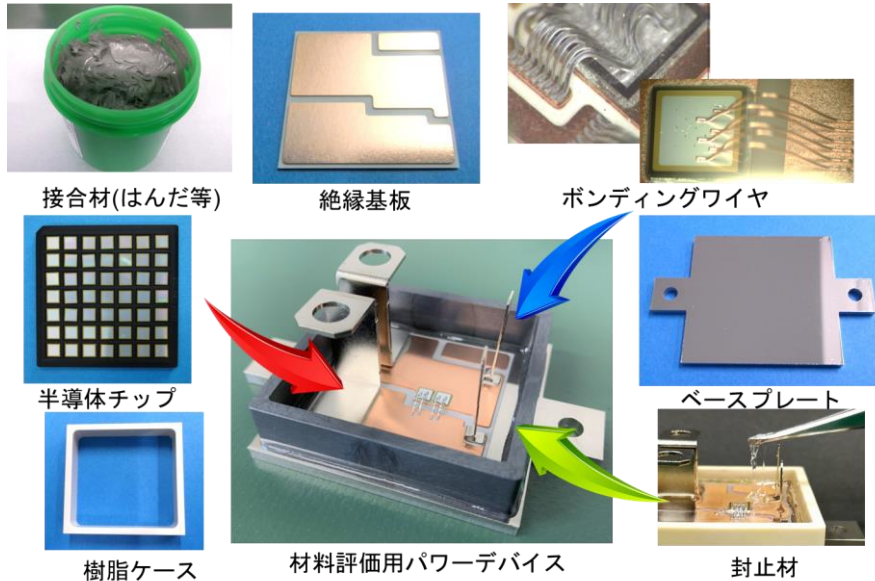


パワーデバイス信頼性試験

材料評価用パワーデバイス試作・評価サービス

次世代パワー半導体の SiC・GaN を用いたデバイス開発には、その周辺材料の性能向上も必須となります。ケミトックスでは、材料の評価で培った長年の経験から、デバイス自体の性能・信頼性評価に限らず、材料評価用パワーデバイスの試作と、これを用いたデバイスの評価まで行っています。製品の性能評価・カタログスペック用データ取得に材料評価用パワーデバイスをご活用ください。



◆対応可能な材料構成および試作設備

ケミトックスで対応可能な材料評価用パワーデバイスの仕様および試作設備は下記の通りです。現在市場に出ているケース型パワーデバイスの構成に対応しております。これ以外の仕様や形状にも設計から対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

材料	対応可能仕様
封止樹脂	当社標準樹脂、支給樹脂ともに対応可 (シリコーンゲル、エポキシなど)
ボンディングワイヤ	Al (φ400um)、Cu (φ200um)
接合材	鉛フリーはんだ、Ag焼結材など
半導体チップ	SBD (ショットキーバリアダイオード)、 MOSFETなど
絶縁基板	セラミック基板 (AlN、Al ₂ O ₃) メタルベース基板
放熱板	Cu (Niめっき)
TIM (Thermal Interface Materials)	当社標準グリース、 支給グリースともに対応可
ケース	PPS、LPS樹脂など

※上記以外の材料や仕様も対応可能ですが、資材の調達が必要な場合がございますので、別途ご相談となります。



お問い合わせ先